

# 位相変調型分光エリプソメーター

株式会社堀場製作所  
UVISEL LT NIR-NNG



位相変調技術に基づき、紫外域から近赤外域までの広範囲な波長域をカバーしており、全波長域に渡って高品質な測定データを採取することができます。また、吸収、発光が可視域にある薄膜でも、近赤外領域の波長を用いることができるため、精度良く測定できます  
測定したデータは装置内ライブラリのパラメーターを使って解析を行います

測定可能波長： 0.6~4.75 eV (2067~261nm)

測定可能膜厚： 試料により異なる

測定範囲： 2mm × 6mm

設置場所： 産業科学研究所 第2研究棟 3F-S315

装置担当： 先端機器室 佐久間